**Nazwa przedmiotu:**

Miernictwo elektryczne

**Koordynator przedmiotu:**

prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

MIE

**Semestr nominalny:**

3 / rok ak. 2018/2019

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
• wykład - 15 godz.
• laboratorium - 15 godz.
• egzamin – 2 godz.
2) Praca własna studenta - 45 godz., w tym:
• przygotowanie do egzaminu - 15 godz.
• przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.
• zapoznanie z literaturą - 5 godz.
• opracowanie sprawozdań -15 godz.
Razem: 77 godz. (3 ECTS)

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

1,5 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 32 godz., w tym:
• wykład - 15 godz.
• laboratorium - 15 godz.
• egzamin – 2 godz.

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

1,5 punktu ECTS – 40 godz., w tym:
• obecość w laboratorium - 15 godz.
• przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.
• opracowanie sprawozdań -15 godz.

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 15h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Fizyka, Elektrotechnika ogólna, Metrologia ogólna, Podstawy elektroniki. Wstęp do technik komputerowych.

**Limit liczby studentów:**

30

**Cel przedmiotu:**

Znajomość metod i technik pomiarów elektrycznych oraz budowy elektrycznych przyrządów pomiarowych ze względu na kluczową pozycję technik pomiarów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych.

**Treści kształcenia:**

Struktury przyrządów i przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych. Oscyloskopy cyfrowe i analogowe. Pomiary napięć i natężenia prądów stałych. Pomiary napięć i natężenia prądów sinusoidalnie zmiennych. Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych odkształconych. Pomiary rezystancji. Pomiary impedancji i parametrów elementów LC. Pomiary mocy. Pomiary częstotliwości, czasu i wielkości pochodnych. Pomiary wybranych wielkości magnetycznych. Przetwarzanie wybranych wielkości fizycznych na sygnały elektryczne. Zaawansowane techniki pomiarowe. Wirtualne przyrządy elektryczne.

**Metody oceny:**

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen ze wszystkich ćwiczeń (ocena sprawozdań).

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki: „Metrologia elektryczna” WNT Warszawa 2010.
2. J. Czajewski: „Podstawy metrologii elektrycznej” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2003.
3. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski: „Podstawy miernictwa” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. A. Marcyniuk: „Podstawy miernictwa elektrycznego” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.
5. W. Nawrocki: „Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002.
6. S. Tumański "Technika pomiarowa"Wydawnictwo Naukowo Techniczne , Warszawa 2007.
7. M. Stabrowski Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

**Witryna www przedmiotu:**

brak

**Uwagi:**

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt MIE\_K\_W10:**

Zna podstawowe techniki w zakresie pomiaru wielkości elektrycznych charakteryzujących pracę urządzeń mechatronicznych

Weryfikacja:

wykład - egzamin, laboratorium - sprawozdania

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W11

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02, T1A\_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt MIE\_U10:**

Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty pomiarowe dotyczace wyznaczania wielkości elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń
mechatronicznych

Weryfikacja:

Laboratorium - sprawozdania

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U05, K\_U13

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U05, T1A\_U08